

## References

- [1] Hoffmann, M.R. et al *Chem.Rev.* 1995, 95, 69.
- [2] Mills, A. et al *J.Photochem.Photobiol. A: Chem.* 1997, 108, 1.
- [3] Fujishima, A. et al *J.Photochem.Photobiol. C: Photochem. Rev.* 2000, 1, 1.
- [4] Chen, X. et al *Chem. Rev.* 2007, 107, 2891.
- [5] Yue, P.L. et al *Chem.Eng.Sci.* 1983, 38, 1893.
- [6] Matthews, R.W. et al *J.Catal.* 1988, 111, 264.
- [7] Nishida-Yamazaki, S. et al *J.Photochem.Photobiol. A:Chem.* 1993, 70, 95.
- [8] Butterfield, I.M. et al *J.Appl.Electrochem.* 1997, 27, 385.
- [9] Candal, R.J. et al *J.Adv.Oxid.Technol.* 1998,3, 270.
- [10] Fernandez-Ibanez, P. et al *Catal.Today* 1999, 54, 329.
- [11] Christensen, P.A. et al *Appl.Cat.B Env.* 2003, 41, 371.
- [12] **Mintsouli, I.; Philippidis, N.; Poulios, I.; Sotiropoulos, S. *J.Appl.Electrochem.* 2006, 36 (4), 463.**
- [13] **Uzunova, M. ; Konstantinov, M.; Georgieva, J.; Dushkin, C.; Todorovsky, D.; Philippidis, N.; Poulios, I.; Sotiropoulos, S. *Appl. Catal. B* 2007, 73(1-2), 23.**
- [14] Egerton, T.A. et al *International Journal of Environment and Pollution* 2006, 27(1-3), 2.
- [15] Fraga, L.E. et al *Electrochim.Acta* 2009, 54(7), 2069.
- [16] Finklea, H.O. *Semiconductor Electrodes*; Elsevier:Amsterdam, 1998.
- [17] Sato, N. *Electrochemistry at Metal and Semiconductor Electrodes*; Elsevier: Amsterdam, 1998, p.p.
- [18] Ohko, Y. et al *J.Electrochem.Soc.* 2004, 148(1), B24.
- [19] O'Regan, B. et al *J.Phys.Chem.* 1990, 94, 8720.
- [20] Vinodgopal, K. et al *J.Phys.Chem.* 1993, 97, 9040.
- [21] Sodergren, S. et al *J.Phys.Chem.* 1994, 98, 5552.
- [22] Patsoura, A. et al *Catal Today* 2007, 124(3-4), 94.
- [23] Byrne, J.A. et al *J.Photochem.Photobiology A: Chem.* 2002, 148(1-3), 365.
- [24] Ivarez-Gallegos A. et al (1998) *Electrochimica Acta*, 44 (5) 853.
- [25] Smotkin, E.S. et al *J.Phys.Chem.* 1986, 90, 4604.
- [26] Vinodgopal, K. et al *Environ. Sci. Technol.* 1995, 29, 841.
- [27] Wu, C.H. et al *J.Hazard.Mater B* 2006, 128, 265.
- [28] Xianzhi, F.U. et al *Environ. Sci.Technol.* 1996, 30, 647.
- [29] Hu, Y. et al *J. Eur. Ceram. Soc.* 2003, 23, 691.
- [30] Papp, J. et al *Chem. Mater.* 1994, 6, 496.
- [31] Li, F.B. et al *Chemosphere* 2005, 59, 787.

- [32] Sibin, C.B. et al *Chem. Mater.* 2002, 14, 2876.
- [33] Zhang, Y. et al *J.Solid State Chem.* 2004, 177, 3490.
- [34] Ranjit, K.T. et al *Environmental Science and Technology* 2001, 35 (7) 1544.
- [35] Agrios, A.G. et al *Journal of Applied Electrochemistry* 2005, 35, 655.
- [36] Chen, X. et al *Chem. Rev.* 2007, 107, 2891.
- [37] O'Regan, B. et al. *Nature (London)* 1991, 353, 737.
- [38] Lu, N. et al *Separ.Purif.Tech.* 2008, 62 (3), 668-673.; Su, Y. et al *Mater.Chem. Phys.* 2008, 110(2-3), 239.
- [39] Wang F. et al (2010) *Superlattices and Microstructures*, 48 (2), pp. 170-180.
- [40] He, T. et al *J.Phys.Chem. B* 2002, 106, 12670.
- [41] Miyauchi, V. et al *Chem.Mater.* 2002, 14, 4714.
- [42] Gillet, M. et al *Thin Solid Films* 2004, 467, 239.
- [43] Shiyonovskaya, V. et al *J.Electrochem.Soc.* 1999, 146, 243.
- [44] Kopp, V. et al *Solid State Commun.* 1977, 22, 677.
- [45] Ohno, T. et al *J.Photochem.Photobiol.A: Chem.* 1998, 118, 41.
- [46] Luo, J. et al *Electrochim.Acta*, 2001, 46, 2913.
- [47] Santato, C. et al *J.Phys.Chem.B* 2001, 105, 936.
- [48] Natarajan, C. et al *J.Electrochem.Soc.* 1996, 143, 1547.
- [49] Chenthamarakshan, C.R. et al *Electrochem.Communic.* 2002, 4, 871.
- [50] De Tacconi, N.R. et al *Electrochem.Communic.* 2003, 5, 220.
- [51] Hepel, M. et al *S. Electrochim. Acta*, 2005, 50, 5278.
- [52] Somasundaram, S. et al *Electrochem. Commun.*, 2006, 8, 539.
- [53] **Georgieva, J.; Armyanov, S.; Valova, E.; Tsacheva, Ts.; Poullos, I.; Sotiropoulos, S. *J.Electroanal.Chem.* 2005, 585, 35.**
- [54] Jiang, D. et al *J.Photochem.Photobiol. A: Chemistry* 2001, 144, 197.
- [55] Waldner, G. et al *Chemosphere* 2003, 50, 989.
- [56] Hou, Y. et al *Science of the Total Environment* 2009, 407(7), 2431.
- [57] Gao, B. et al *Applied Catalysis B: Environmental* 2008, 85 (1-2), 17.
- [58] Zhang, F.-J. et al *Korean Journal of Materials Research* 2008, 18 (11), 583.
- [59] Qu, J. et al *Environmental Science and Technology*, 2008, 42(13), 4934.
- [60] Manivannan, A. et al. *Electrochemical and Solid-State Letters* 2005, 8(10), C138-C140.
- [61] Shang, J. et al *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical* 2003, 202, 187.
- [62] Chan, A.H.C. et al *Water Research* 2003, 37(5), 1125.
- [63] **Georgieva, J.; Armyanov, S.; Valova, E.; Poullos, I.; Sotiropoulos, S. *Electrochim.Acta*, 2006, 51(10), 2076.**

- [64] Georgieva, J.; Armyanov, S.; Valova, E.; Poullos, I.; Sotiropoulos, S. *Electrochem. Commun.* 2007, 9, 365.
- [65] Georgieva, J.; Armyanov, S.; Valova, E.; Phillipides, N.; Poullos, I.; Sotiropoulos, S. *J. Adv. Oxid. Proc.*, 2009
- [66] Park, J.H. et al *J. Electrochem. Soc.* 2008, 155(7), F145.
- [67] Greenwood, M.A. *Photonics Spectra* 2008, 42 (5), 94.
- [68] Miettunen, K. et al *J. Phys. Chem. C* 2008, 112 (10), 4011.
- [69] Kyung-Won Park et al *Electrochemistry Communications* 9 (2007) 1578.
- [70] J. Georgieva, S. Armyanov, I. Poullos, D.A. Jiannakoudakis and S. Sotiropoulos, *Electrochemistry and Solid State Letters*, (2010)
- [71] Peill, N.J. et al *Environ. Sci. Technol.* 1995, 29, 2974.
- [72] Byrne, J.A. et al *Appl. Catal. B: Environmental*, 1998, 17, 25.
- [73] Krysa, J. et al *J. Appl. Electrochem.* 2002, 32, 591.
- [74] Takahashi, Y.; et al *J. Mater. Sci.* 1998, 23, 2259.
- [75] O'Regan, B. et al *J. Phys. Chem.* 1990, 94, 8720.
- [76] Kato, K. et al *J. Mater. Sci.* 1995, 30, 837.
- [77] Sugimoto, T. et al *J. Colloid Interface Sci.* 2003, 259, 43.
- [78] Zhang, H. et al. *Chem. Mater.* 2005, 17, 3421.
- [79] Anderson, M.A. et al *J. Membr. Sci.* 1988, 39, 243.
- [80] Barringer, E.A. et al *Langmuir* 1985, 1, 420.
- [81] Look, J. L. et al *J. Am. Ceram. Soc.*, 1995, 78, 21.
- [82] Vorkapic, D. et al *J. Colloid Interface Sci.* 1999, 214, 283.
- [83] Shin, H. et al *J. Mater. Res.* 1995, 10, 692.
- [84] Langlet, M. et al *J. Mater. Sci.* 2003, 38, 3945.
- [85] Anderson, M. et al *J. Phys. Chem. B* 2002, 106, 10674-10679.
- [86] Yang, J. et al *J. Colloid Interf. Sci.* 2003, 260, 82-.
- [87] Han, Y. et al *J. Mater. Sci. Tech.* 2008, 24 (5), 816.
- [88] Kavan, L. et al *Electrochim. Acta*, 1995, 40, 643-.
- [89] Martinez, A.I. et al *J. Phys.: Condens. Matter.* 2004, 16, S2335-.
- [90] Yanagi, H. et al *Appl. Surf. Sci.* 1997, 113-114, 426-431.
- [91] Shinde, P.S. et al *Solar Energy Materials and Solar Cells* 2008, 92 (3), 283-290.
- [92] Enesca, A. et al *Proceedings of the International Semiconductor Conference, 2005*, CAS 2 art.no. 1558782, 293-296.
- [93] Sivakumar, R. et al *Mater. Res. Bullet.* 2004, 39 (10), 1479-1489.
- [94] Regragui, M. et al *Solar Energy Materials and Solar Cells* 2003, 77 (4), 341-350.
- [95] Patil, P.S.; et al *Bulletin of Materials Science* 1996, 19(4), 651-656.
- [96] Davazoglou, D. et al *O. Solar Energy Materials* 1987, 16(1-3), 55-65.

- [97] [Gogova, D.](#) et al *J. Crystal Growth* 1999, 198-199 (pt 2), 1230-1234.
- [98] [Hitchman, M.; Tian F.](#) *J. Electroanal. Chem.* 2002, 538-539, 165-172.
- [99] [Murakami, T.N.](#) et al *J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry* 2004, 164 (1-3), 187-191.
- [100] [Ivanova, T.](#) et al *Mater. Sci. Eng. B: Solid-State Mater. Adv. Tech.* 2007, 142 (2-3), 126-134.
- [101] [Li Puma, G.](#) et al *J. Haz. Mat.* 2008, 157 (2-3), 209-219.
- [102] [Ivanova, T.](#) et al *Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology*, 2007, 142 (2-3), 126-134.
- [103] Rosario, A.V. et al. *Thin Solid Films* 2002, 410 (1-2), 1-7.
- [104] Hechavarria, L et al *J. Solid State Electrochem.* 2009, 13 (5), 687-695.
- [105] Saeki, I. et al *J. Electrochem. Soc.* 1996, 143 (7), 2226-2230.
- [106] [Velten, D.](#) et al *J. Biomed. Mater. Res.* 2002, 59 (1), 18-28.
- [107] Smotkin, E. et al *J. Phys. Chem.* 1986, 90(19), 4604-4607.
- [108] Li, X.Z. et al *J. Env. Sci. Health-Part A*, 2002, 37(1), 55-69.
- [109] Raja, K.S. et al *J. Power Sources* 2006, 161(2), 1450-1457.
- [110] Xie, Y. *Electrochim. Acta* 2006, 51(17), 3399-3406.
- [111] Lin, C.-J. et al *Appl. Phys. Lett.* 2009, 94(11), art.no. 113102.
- [112] Sadek, A.Z. et al *Langmuir* 2009, 25(1), 509-514.
- [113] Hardee, K.L.; Bard, A.J. *J. Electrochem. Soc.* 1977, 124(2), 215-224.
- [114] Reichman, B.; Bard, A. J. *J. Electrochem. Soc.* 1977, 126(12), 2133-.
- [115] De Tacconi, N.R. et al *J. Phys. Chem. B* 2006, 110(50), 25374-25355.
- [116] Watchharenwong, A. et al *J. Electroanal. Chem.* 2008, 612(1), 112-120.
- [117] Kavan, L. et al *J. Electroanal. Chem.* 1993, 346, 291-307.
- [118] Natarajan, C. et al *G. J. Electrochem. Soc.* 1996, 143, 1547-1550.
- [119] Zhitomirski, I.; Gal-Or, L.; Khon, A.; Henniske, H.W. *J. Mater. Sci.* 1995, 30, 5307-5312.
- [120] Zhou, M et al *J. Electroanal. Chem.* 1997, 421, 111.
- [121] De Tacconi et al *Langmuir* 1998, 14, 2933.
- [122] De Tacconi, N.R. et al *Langmuir* 1998, 16, 5665.
- [123] Somasundaram, S. et al *J. Electroanal. Chem.* 2005, 577, 167.
- [124] Pauporte, T. *J. Electrochem. Soc.* 2002, 149(11), C539-C545.
- [125] Pauporte, T. et al *J. Phys. Chem. Solids* 2003, 64, 1737.
- [126] De Tacconi, N.R. et al *Electrochem. Commun.* 2003, 5, 220.
- [127] N. Hebestreit et al *Electrochim. Acta* 48 (2003) 1779.

- [128] Cristescu, C. , Andronie, A. , Iordache, S. , Stamatina, S.N. , Constantinescu, L.M. , Rimbu, G.A. , Iordoc, M. , Vasilescu-Mirea, R. , Iordache, I. , Stamatina, I. (2008) *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials*, 10 (11), pp. 2985-2987.
- [129] M.Ilieva et al *J.Appl.Electrochem.* 38 (2008) 63.
- [130] Khomenko, V.G., Barsukov, V.Z., Katashinskii, A.S., *Electrochimica Acta*, 50(7-8) (2005) 1675.
- [131] Barsukov, V.Z., Khomenko, V.G., Katashinskii, A.S., *NATO Security through Science Series A: Chemistry and Biology*, (2007) 883.
- [132] I.J.Brown and S.Sotiropoulos, *Electrochimica Acta*, 46 (2001) 2711.
- [133] I.J.Brown and S.Sotiropoulos, *Journal of Applied Electrochemistry*, 31 (2001) 1203.
- [134] Papadimitriou, S; Tegou, A; Pavlidou, E; Valova, E; Arnyanov, S; Kokkinidis, G and Sotiropoulos\*,S, *Electrochim.Acta*, 53(22) (2008) 6559.
- [135] Qiaoling Li et al, *Applied Surface Science* Volume 257, Issue 3, 15 November 2010, 944.